

## طراحی و شبیه‌سازی فشارسنج و شتابسنج مبتنی بر مدارات مجتمع نوری با استفاده از اثر فوتولاستیسیته لیتیوم نیوبات

ندا جودی<sup>۱</sup>، رضا اسدی<sup>۱</sup>، پیام حیدری<sup>۲</sup> و مریم گنجی<sup>۱</sup>

۱. مجتمع برق و الکترونیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

۲. دانشکده مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

(دریافت مقاله: ۱۳۹۴/۹/۱۴؛ دریافت نسخه نهایی: ۱۳۹۴/۹/۲۱)

### چکیده

در این مقاله فشارسنج و شتابسنج نوری جدیدی مبتنی بر ادوات میکروالکترونیک با استفاده از تداخل سنج ماخ-زندر مجتمع در دریچه لیتیوم نیوبات طراحی شده است. در این حسگر با اعمال فشار و شتاب، دریچه دچار کرنش می‌شود و به علت اثر فوتولاستیسیته تغییرات ضربی شکست در موج بر نوری واقع در دریچه ایجاد می‌شود. تغییر ضربی شکست، باعث تأخیر فاز نور منتشر شده در موج بر گردیده و این تغییر فاز توسط تداخل سنج ماخ-زندر، به تغییرات شدت نور تبدیل می‌شود، برای محاسبه تنش ایجاد شده در دریچه از نرم‌افزار ANSYS ۱۴,۵ استفاده شد و حساسیت فشارسنج و شتابسنج طراحی شده به ترتیب  $(rad.s^{-1}/m)^0$  و  $(rad.s^{-1}/m)^{+2,22}$  به دست آمد.

**واژه‌های کلیدی:** ابتیک مجتمع، دستگاه‌های میکروالکترونیک، فشارسنج، فوتولاستیک

### ۱. مقدمه

امروزه کوچکسازی انواع حسگرهای جمله شتاب و فشارسنج‌ها به خصوص برای استفاده در صنایع هوافضای ماهواره برای کاربرد هدایت و ناویری بسیار حائز اهمیت است [۱]. برای این منظور استفاده از فناوری میکروماشینی و دستگاه‌های میکروالکترونیک (MEMS) بسیار مورد توجه

می‌باشد. اولین شتابسنج مبتنی بر این فناوری در سال ۱۹۷۹ ارائه شد [۲]. فشار و شتابسنج‌هایی که در طی سال‌های گذشته با استفاده از میکروماشین کاری ساخته شده‌اند غالباً از نوع پیزو مقاومتی و یا خازنی هستند، فشارسنج‌های پیزومقاومتی به جهت پاسخ خطی که دارند مشهورند، اما وابسته به دما هستند. حسگرهای فشار

۱۹۸۲، اولین فشارسنج تار نوری را مبتنی بر اثر فوتوالاستیک ارائه داد [۵]. این روش با توجه به قابلیت تار نوری برای استفاده در درون ساختمان‌ها و پل‌ها برای اندازه‌گیری تنش و فشارهای داخلی ساختمان، بسیار مورد توجه قرار گرفت [۶]. در سال‌های اخیر با رشد فناوری میکروماشین کاری، استفاده از این اثر برای ساخت فشارسنج‌های مجتمع بسیار مورد توجه قرار گرفته شده است و تاکنون انواع مختلفی از فشارسنج‌ها و شتابسنج‌های نوری مجتمع در بسته مواد نیم‌رسانا و دی‌الکتریک از جمله سیلیکون (Si) طراحی و ساخته شده‌اند [۷ - ۹]. مزیت این نوع مواد فرایند ساده میکروماشین کاری در آنها می‌باشد، که علت آن استفاده گسترده این مواد در صنایع میکروالکترونیک و توسعه فرایندهای میکرولیتوگرافی و سونش<sup>۱</sup> در آنها است. با این حال در این مواد لازم است موج بر به صورت پله‌ای و با استفاده از فرایندهای سونش انجام شود. این امر باعث ایجاد اختلاف ضریب شکست زیاد بین ناحیه هسته و پیرامون موج بر می‌شود. بنابراین برای جلوگیری از تلفات درون موج بر در اثر نواقص و ناصافی‌های سطحی، احتیاج به دستگاه‌های لیتوگرافی بسیار دقیق (بهتر از یک میکرومتر) می‌باشد، که بسیار پرهزینه است.

برای رفع مشکلات مورد اشاره در فشارسنج‌های نوری مبتنی بر موج برهای سیلیکونی، در این طرح یک نمونه فشار و شتابسنج نوری مجتمع، مبتنی بر اثر فوتوالاستیک در دریچه‌ای از بلور لیتیوم نیوبات ( $\text{LiNbO}_3$ ) طراحی و حساسیت آن بررسی می‌شود. مزیت بلور لیتیوم نیوبات، امکان ساخت موج بر و مدارت مجتمع نوری در آن با روش‌های بسیار ساده‌تر و کم‌هزینه می‌باشد، زیرا در این ماده امکان ایجاد موج بر نوری با استفاده از فرایند نفوذ مواد مختلف برای تغییر ضریب شکست ناحیه موج بر وجود دارد. از جمله روش‌های ساده مورد استفاده برای ساخت موج بر در این بلور، لایه‌نشانی فلز Ti و نفوذ آن توسط قرار دادن در کوره در دمای حدود ۱۰۰۰ درجه سانتی‌گراد است که این روش به صورت گسترده برای

خازنی حساسیت کمتری نسبت به دما دارد، اما پاسخ آنها به فشار غیرخطی است، با وجود مزایای حسگرهای MEMS از لحاظ کوچکی مشکل عملده در این نوع حسگرهای، نیاز آنها به مدارات مجتمع الکترونیکی برای خواندن و پردازش اطلاعات حسگر در محل حسگر و به صورت مجتمع می‌باشد، که ضمن پیچیده کردن فرایند ساخت آنها باعث حساسیت زیاد آنها به تداخل‌های الکترومغناطیس می‌شود. علاوه بر این، افزایش دمای قطعات الکترونیکی ضمن ایجاد خطر اشتعال می‌تواند باعث افزایش خطأ و نرخه حسگر شود.

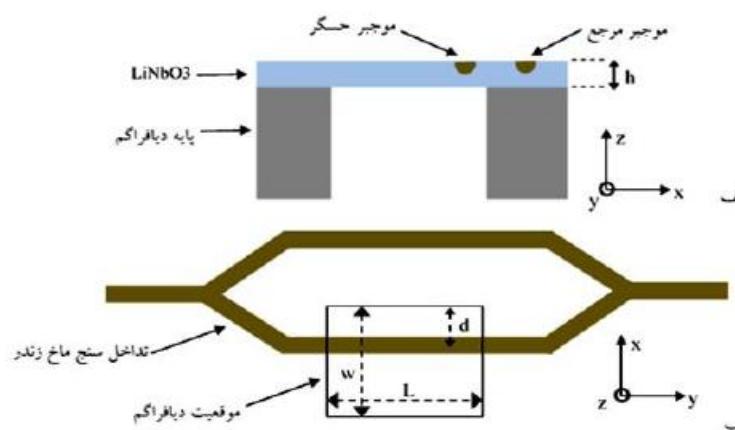
برای رفع مشکلات مورد اشاره، استفاده از فناوری میکروپایتوالکترومکانیک (MOEMS) به جای MEMS و استفاده از سیگنال نوری به جای سیگنال الکترونیکی می‌تواند مؤثر باشد. به این ترتیب می‌توان با استفاده از مدارات مجتمع نوری ضمن کوچکسازی حسگر، از اثر نامطلوب تداخل‌های الکترومغناطیسی و افزایش دما مصنوع ماند، از طرفی در این دستگاه‌ها، اندازه‌گیری و تحلیل سیگنال حسگر در محل حسگر مورد نیاز نیست و سیگنال‌های نوری می‌توانند در تارهای نوری منتقل شوند، این ویژگی مخصوصاً در محیط حاوی مواد منفجره و یا در محیط‌های حساس الکترومغناطیسی بسیار مهم است.

یکی از روش‌های مورد استفاده در فشارسنج‌های نوری، استفاده از اثر فوتوالاستیک است. در این اثر، که برای اولین بار توسط دیوید بروستر<sup>۲</sup> در سال ۱۸۱۵ کشف شد، دوشکستی<sup>۳</sup> مصنوعی در اثر تنش مکانیکی ایجاد می‌شود و ضریب شکست در ماده متناسب با تنش و فشار اعمالی تغییر می‌کند [۲]. این اثر عموماً برای اندازه‌گیری تنش‌های داخلی باقی مانده در مواد مختلف در فرایند تولید که تأثیر زیادی در کیفیت و استحکام محصولات دارد، مورد استفاده قرار گرفته می‌گیرد [۴]. با توسعه فناوری تار نوری، اسپیلمن<sup>۴</sup> در سال

۱. David Brewster

۲. Birefringence

۳. Spillman



شکل ۱. طرح واره فشار سنج در بجهای مبتنی بر اثر فوتولاستیسیته با استفاده از تداخل سنج ماخ-زندر، (الف) نگاه از برش در صفحه XZ از محل دیافراگم و (ب) نگاه از بالای صفحه در بجه.

برای مدولاسیون با بسامد مورد نظر قرار گیرد. فاز نور در موج بر قرار داده شده بر روی دریچه، تحت کرنش ناشی از اعمال فشار تغییر می‌کند و سپس توسط تداخل سنج ماخ-زندر با نور مرجع تداخل داده می‌شود. اگر دو نور خروجی از هر یک از شاخه‌ها هم‌فاز باشند، تداخل از نوع سازنده و شدت خروجی بیشینه می‌شود، و زمانی که دو نور خروجی  $180^\circ$  درجه اختلاف فاز داشته باشند، تداخل از نوع مخرب و شدت خروجی کمینه می‌شود. به این ترتیب با اندازه‌گیری شدت خروجی امکان اندازه‌گیری اختلاف فاز ایجاد شده، که متناسب با فشار اعمالی است، میسر می‌شود. طول (L)، عرض (w) و ضخامت (h) اولیه دریچه به ترتیب  $3\text{ mm}$ ،  $2\text{ }\mu\text{m}$  و  $20\text{ }\mu\text{m}$  در نظر گرفته شده است. عرض و عمق موج بر برای تطبیق با اندازه تار  $10\text{ }\mu\text{m}$  می‌باشد که در درون بلور  $\text{LiNbO}_3$  با روش نفوذ فلزات مختلف از جمله  $\text{Ti}$  قابل ساخت است. مکان موج بر برای دست‌یابی به بیشترین حساسیت انتخاب می‌شود و همان طور که در ادامه نشان داده خواهد شد این مکان مماس با لبه دریچه می‌باشد. البته با توجه به محدودیت‌های ساخت فاصله موج بر تا لبه دریچه  $1\text{ mm}$  و  $d=10\text{ }\mu\text{m}$  در نظر گرفته شده است.

### ۳. نظریه

تغییر در ضریب شکست به علت تنش<sup>۵</sup> خارجی به عنوان اثر

ساخت مدارات مجتمع نوری مورد نیاز در صنایع مخابرات به صورت تجاری استفاده می‌شود [۱۰ و ۱۱]. علاوه بر این، استفاده از روش نفوذ، برخلاف استفاده از روش‌های سونش که در دیگر مواد (مثل  $\text{Si}$ ) متداول است، باعث ایجاد اختلاف ضریب شکست کم بین موج بر و محیط پیرامون و همین طور تغییرات تدريجی ضریب شکست در لبه موج بر و در نتیجه کاهش تلفات نور در موج بر می‌شود. از طرف دیگر ماده لیتیوم نیوبیات (برخلاف  $\text{Si}$  و  $\text{SiO}_2$ ) دارای خواص الکتروپاتیک مناسبی است که از آن برای ساخت مدولاتورهای الکتروپاتیک با بسامد بالا (بیش از یک گیگاهرتز) استفاده می‌شود. بنابراین با استفاده از این ماده این امکان فراهم می‌شود تا حساسیت حسگر را با استفاده از مدوله کردن سیگنال در بسامد مشخص و حذف بسامدهای دیگر توسط فیلترهای بسامدی مناسب، افزایش داد.

## ۲. ساختار طرح

شکل ۱ طرح واره حسگر طراحی شده با استفاده از تداخل سنج ماخ-زندر را نشان می‌دهد که متشکل از دو موج بر است و در آن نور از طریق تار نوری وارد می‌شود و به دو قسمت تقسیم شده و در دو مسیر مجزا درون دو موج بر انتشار می‌یابد، یک شاخه از موج برها بر روی دریچه و تحت تأثیر اعمال فشار و یا شتاب قرار می‌گیرد، و شاخه دیگر خارج از دریچه به عنوان موج بر مرجع استفاده می‌شود که می‌تواند تحت میدان الکتریکی

با توجه به تقارن تانسور  $P$  ( $P_{ijk}=P_{jik}=P_{jki}$ ), رابطه (۲) را می‌توان با استفاده از نماد گذاری به صورت  
 $1=xx=2xx=3xx=4xx=5xx=6xy=6xz=5yz=4yz$  به شکل ضرب  
 ماتریسی مطابق رابطه (۳) بازنویسی کرد [۱۲]:

$$\Delta a_m = \sum_n P_{mn} S_n \quad (m, n) = 1, 2, \dots, 6 \quad (2)$$

بلور  $\text{LiNbO}_3$  در دمای اتاق به صورت شبکه‌ای با تقارن مثلثی  $2m$  است، که انواع تجارتی آن عموماً به صورت متجانس<sup>۷</sup> رشد داده می‌شوند و دارای ماتریس  $P$  به صورت زیر می‌باشد [۱۲ و ۱۴]:

$$P = \begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} & P_{13} & P_{14} & \cdot & \cdot \\ P_{12} & P_{11} & P_{13} & -P_{14} & \cdot & \cdot \\ P_{13} & P_{12} & P_{11} & \cdot & \cdot & \cdot \\ P_{14} & -P_{11} & \cdot & P_{14} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & P_{44} & P_{41} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & P_{41} & (P_{11} - P_{12})/2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -0.0261 & 0.0876 & 0.1335 & -0.0832 & \cdot & \cdot \\ 0.0876 & -0.0261 & 0.1335 & 0.0832 & \cdot & \cdot \\ 0.1767 & 0.1767 & 0.0702 & \cdot & \cdot & \cdot \\ -0.01507 & 0.01507 & 0.0453 & 0.053 & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 0.053 & -0.0507 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & -0.0832 & +0.0568 \end{bmatrix} \quad (4)$$

با محاسبه تغییر مؤلفه‌های ماتریس  $a$  توسط رابطه (۲)، امکان محاسبه تغییر ضریب شکست با توجه به جهت انتشار و قطبش نور به دست می‌آید. برای این منظور باید معادله بیضوی (دوبعدی) ناشی از تقاطع صفحه عمود بر بردار موج نور ( $k$ ) را با بیضوی ضریب شکست به دست آورد، جهت فطرهای بزرگ و کوچک بیضوی به دست آمده، جهت بردار جابه‌جایی الکتریکی ( $D$ ) نور و اندازه آنها، ضرایب شکست برای دو ویژه‌مد ماده (برای بردار موج  $k$ ) را مشخص می‌کند. محاسبه ضریب شکست برای قطبش مورد نظر باید با توجه به سهم هر یک از ویژه‌مدان در قطبش اولیه محاسبه شود. به این ترتیب با محاسبه تغییر ضریب شکست برای قطبش مورد نظر، تغییر فاز نور درون موج بر و شدت نور خروجی تداخل‌سنج به صورت زیر به دست می‌آیند [۱۲]:

فوتوالاستیسیته شناخته می‌شود. مبنای عملکرد فشارسنج مجتمع نوری مبتنی بر اثر فتوالاستیسیته به این ترتیب است که اعمال فشار بر روی دریچه که موج بر نور در آن ایجاد شده است، باعث تغییر ضریب شکست و در نتیجه تغییر فاز نور درون موج بر متناسب با اعمال فشار می‌شود. بنابراین با اندازه‌گیری مقدار تغییر فاز نور، می‌توان فشار اعمالی به دریچه را اندازه‌گیری کرد.

اعمال فشار باعث خمیدگی دریچه و ایجاد تنش و کرنش<sup>۸</sup> در آن خواهد شد. تنش نسبت نیروی اعمال شده به سطح است، که منجر به کرنش درون دریچه می‌شود و کرنش نسبت تغییرات طول (بر اثر تنش اعمال شده) به طول قبل از اعمال تنش است. تغییر طول ناشی از کرنش نیز باعث تغییر تانسور گذردگی و در نتیجه ضریب شکست ماده می‌شود. با توجه به جهت اعمال فشار، کرنش و تغییر طول ایجاد شده در جهات مختلف متفاوت است. این اثر باعث ایجاد ناهمسان‌گردی در ماده و تفاوت تغییر ضریب شکست برای نور با قطبش‌های مختلف و جهات انتشار مختلف می‌شود. بنابراین برای مشخص کردن ضریب شکست (قبل و بعد از اعمال فشار) لازم است از معادله بیضوی (سه‌بعدی) ضریب شکست رابطه (۱) استفاده شود. با استفاده از این بیضوی می‌توان ضریب شکست و راستای قطبش و ویژه‌مد نور مربوط به جهت نور انتشاری مورد نظر را مشخص کرد. معادله بیضوی در حالت کلی در دستگاه مختصات دکارتی  $(x, y, z)$  به صورت زیر است [۱۲]:

$$\sum_{ij} a_{ij} x_i x_j = 1 \quad i, j = x, y, z \quad (1)$$

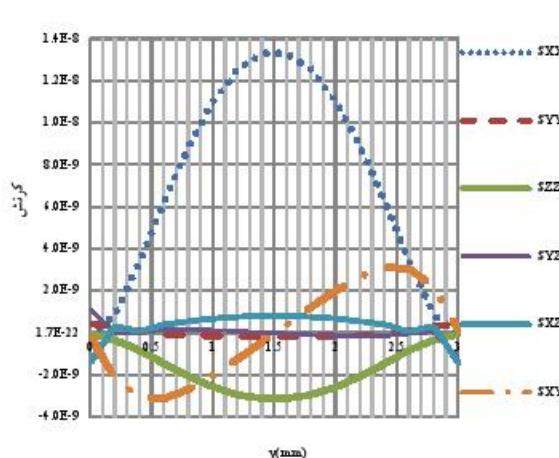
در اثر پدیده فتوالاستیک، کرنش ایجاد شده در اثر فشار باعث تغییر ضرایب  $a$  به صورت زیر می‌شود [۱۲]:

$$\Delta a_{ij} = \sum_{kl} P_{ijkl} S_{kl}, \quad (2)$$

که در آن  $P_{ijkl}$  تانسور فتوالاستیک و  $S_{kl}$  تانسور کرنش می‌باشند. مؤلفه‌های قطری تانسور کرنش ( $S_{xx}, S_{yy}, S_{zz}$ ) کرنش اصلی و مؤلفه‌های غیر قطری آن ( $S_{xy}, S_{xz}, S_{yz}$ ) کرنش برشی هستند.

<sup>۷</sup>. Congruent

<sup>۸</sup>. Strain

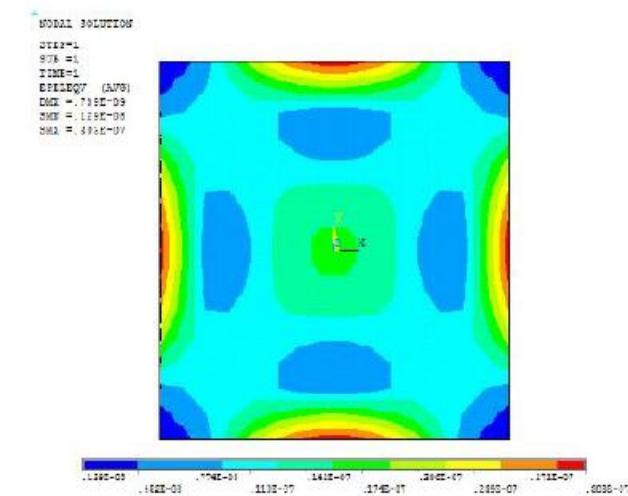


شکل ۲. (رنگی در نسخه الکترونیکی) کرنش در عمق ۵ میکرومتری در محل موج بر (با فاصله ۱۰۰ میکرومتر از لبه دریچه) بر اثر اعمال فشار یکنواخت یک پاسکال.

نرم افزار از روش مدل سازی اجزای محدود برای حل معادلات دیفرانسیل استفاده می شود و در آن امکان محاسبه جابه جایی، تنش و کرنش ایجاد شده در اثر اعمال فشار میسر است [۱۵].

برای شبیه سازی، یک دریچه مریعی به ضلع ۲ میلی متر و با ضخامت ۲۰ میکرومتر با لبه های محکم شده در صفحه  $\perp z$  در نظر می گیریم سپس مقدار کرنش ایجاد شده در اثر فشار یکنواخت یک پاسکال در راستای محور  $z$  در نقاط مختلف سطح دریچه محاسبه می شود. مقادیر پارامترهای مورد استفاده در شبیه سازی در جدول ۱ ارائه شده است. برای اعمال شرایط مرزی، مقدار جابه جایی دریچه در لبه ها صفر در نظر گرفته می شود.

در شکل ۲ نتایج شبیه سازی برای مقدار کرنش فون میزس<sup>۸</sup> (کرنش معادل) نشان داده شده است. مطابق انتظار و همین طور بر اساس شکل ۲ بیشترین تنش و کرنش در نزدیک لبه دریچه ایجاد می شود. بنابراین مکان موج بر در نظر گرفته می شود. در شکل ۲ فاصله ۱۰۰ میکرومتر از لبه در نظر گرفته می شود. در شکل ۲ مقدار مؤلفه های مختلف کرنش در لبه موج بر و در عمق ۵ میکرومتری نشان داده شده است. علت انتخاب عمق ۵



شکل ۲. (رنگی در نسخه الکترونیکی) کرشن فون میزس در یک مریعی به ضلع ۲ mm و ضخامت ۲۰  $\mu\text{m}$  با اعمال فشار یکنواخت یک پاسکال.

جدول ۱. مقادیر مورد استفاده در طراحی و شبیه سازی [۱۶].

مدول یانگ	۱۸۰ Gpa
ضریب پواسن	۰,۱۲۴
چگالی	۴,۶۴۸ g/cm <sup>۳</sup>
فشار	۱ Pa

$$\Delta\phi = \frac{\pi}{\lambda} \Delta n , \quad (5)$$

$$I = \frac{I_0}{2} (1 + \cos(\Delta\phi + \phi_0)) , \quad (6)$$

که در آن  $I$  و  $\phi$  به ترتیب شدت ورودی و اختلاف فاز دو شاخه موج بر بدون اعمال فشار است. مقدار  $\phi$  می تواند به علت اختلاف طول موج برها دو شاخه ایجاد شود و یا در مورد مواد الکتروپاتریک مثل LiNbO<sub>3</sub> این فاز می تواند توسط اعمال میدان الکتریکی، کنترل و همین طور در بسامد مشخصی مدلوله شود، که باعث مدلوله شدن شدت نور خروجی مانند زندر خواهد شد.

#### ۴. شبیه سازی کرنش

برای محاسبه مقدار کرنش اعمالی به دریچه از شبیه سازی با استفاده از نرم افزار ANSYS ۱۴/۵ استفاده می شود، در این

۸. Von Mises

راستای محور  $z$  و جهت قطبش نور را در راستای  $z$  در نظر می‌گیریم. در این صورت عناصر غیر قطری ضرایب  $a$  صفر خواهند شد. با توجه به این که برای نور منتشر شده در راستای  $z$  مؤلفه قطبش نور نیز در راستای  $z$  صفر است، معادله بیضی ضریب شکست (ناشی از تقاطع صفحه عمود بر بردار موج با بیضوی سه بعدی ضریب شکست) به صورت زیر ساده می‌شود:

$$a_1x^2 + a_2z^2 = 1 \quad (7)$$

که در آن،  $a_1$  و  $a_2$  مؤلفه‌های ماتریس قطری شده  $a$  قبل از اعمال فشار است که مقادیر آن از ضرایب شکست اولیه ماده به صورت زیر به دست می‌آیند:

$$a_{10} = \frac{1}{n_0^2} = 0.204, \quad (8)$$

$$a_{20} = \frac{1}{n_e^2} = 0.218.$$

$n_0 = 2/21$  و  $n_e = 2/14$  [۱۸] به ترتیب ضرایب شکست بلور  $\text{LiNbO}_3$  برای قطبش‌های موازی محور  $x$  و  $z$  در طول موج نور عبوری  $\lambda = 155\text{ nm}$  می‌باشند، که به ضرایب شکست عادی و غیر عادی معروف هستند.

بعد از اعمال فشار، معادله بیضوی ضریب شکست به صورت زیر خواهد بود.

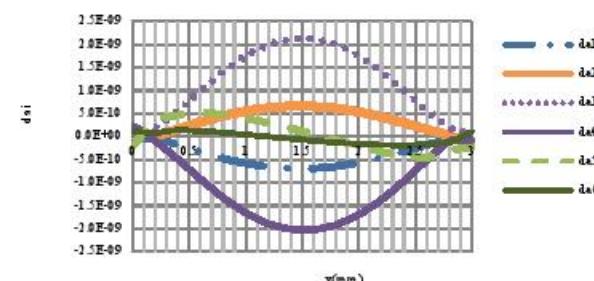
$$(a_{10} + da_1)x^2 + da_2y^2 + (a_{20} + da_2)z^2 + da_3xz + da_4xy = 1. \quad (9)$$

با توجه به این که جهت انتشار و بردار موج در راستای محور  $y$  است، معادله بیضی ضریب شکست (ناشی از تقاطع صفحه عمود بر بردار موج و معادله بیضوی ضریب شکست) با قرار دادن  $y = 0$  در رابطه (۹) به دست می‌آید:

$$(a_{10} + da_1)x^2 + (a_{20} + da_2)z^2 + da_3xz = 1 \quad (10)$$

وجود مؤلفه غیر قطری  $da_5$  در معادله بیضی ضریب شکست، باعث چرخش بیضی می‌شود. برای محاسبه ضرایب شکست جدید باید اندازه و جهت قطرهای بزرگ و کوچک بیضی ضریب شکست مشخص شوند. برای این منظور ابتدا مقدار چرخش بیضی را به صورت زیر به دست می‌آوریم:

$$\tan(\theta_P) \approx P(\text{pas}) \frac{da_5(\text{pas})}{a_{10} - a_{20}} \approx 10^{-12} (\text{rad}) \quad (11)$$



شکل ۴. (رنگی در نسخه الکترونیکی) تغییرات ضرایب بیضوی ضریب شکست ( $da_i$ ) موج بر تحت اعمال فشار یکنواخت پک پاسکال در عمق ۵ میکرومتری موج بر.

میکرومتر از این جهت است که عمق موج بر نوری برای تطبیق با تار ورودی ۱۰ میکرومتر در نظر گرفته می‌شود. بنابراین تمرکز نور منتشر شده در موج بر تقریباً در مرکز موج بر و عمق ۵ میکرومتری خواهد بود.

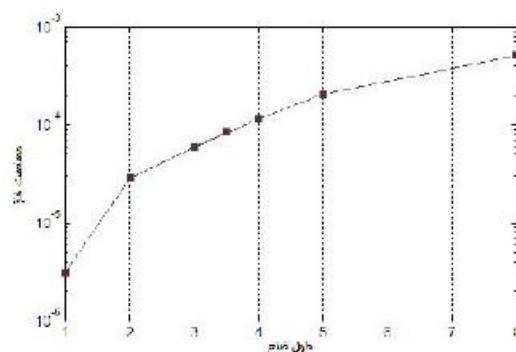
همین طور حداقل شتاب قابل تحمل دریچه قبل از شکست با توجه به آستانه تحمل<sup>۹</sup> لیتیوم نیوبیات و چگالی آن که به ترتیب  $110 \text{ MPa}$  [۱۷] و  $4.65 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$  است، با استفاده از شبیه‌سازی تنش فون میزس توسط نرم‌افزار برابر  $2.2 \times 10^3 \text{ m/s}^2$  است.

## ۵. محاسبه تغییر فاز نور خروجی از موج بر

برای محاسبه تغییر فاز نور خروجی از موج بر (در اثر فشار اعمالی)، ابتدا با استفاده از مقدار کرشم به دست آمده در شکل ۳ و رابطه ۳، مقدار تغییر در ضرایب بیضوی ضریب شکست محاسبه می‌شود، که نتایج آن در شکل ۴ ارائه شده است.

همان طور که از شکل ۴ مشخص است از بین مؤلفه قطری، مؤلفه  $da_5$  بیشترین تغییرات را دارد. بنابراین برای داشتن بیشترین حساسیت همچنین برای جلوگیری از پیچیدگی محاسبات، دستگاه مختصات قبل از اعمال فشار را منطبق بر محورهای اصلی و محور  $z$  را منطبق بر محور اپتیکی بلور  $\text{LiNbO}_3$  در نظر می‌گیریم. همین طور جهت موج بر و جهت انتشار نور را در

<sup>9</sup>. Yield strength



شکل ۶ تغییر حساسیت حسگر با تغییرات ضلع دریچه مربعی.

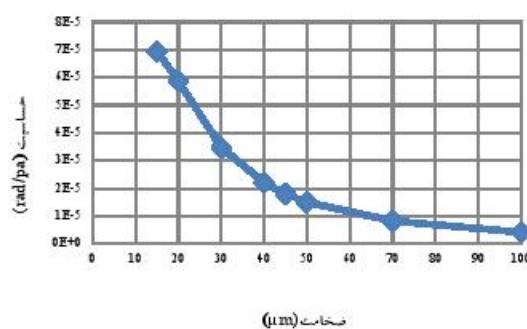
صورت زیر به دست می‌آید

$$S_p = \frac{d\phi}{dp} = \Delta\phi (1 \text{ pas}) \approx 5.87 \times 10^{-5} \frac{\text{rad}}{\text{pas}} \quad (14)$$

فشارسنج طراحی شده، امکان استفاده به عنوان شتابسنج را نیز دارد که حساسیت آن با در نظر گرفتن چگالی و ضخامت دریچه به صورت زیر به دست می‌آید

$$S_a = \frac{d\phi}{da} = S_p \frac{dP}{da} = S_p \rho h \approx 8.45 \times 10^{-6} \frac{\text{rad/s}^2}{\text{m}} \quad (15)$$

در شکل ۵ بستگی حساسیت حسگر به ضخامت‌های مختلف دریچه در محدوده ۱۵ تا ۱۰۰ میکرومتر برای دریچه مربعی با ابعاد ۲ میلی‌متر و در شکل ۶ تغییرات حساسیت با تغییر اندازه ضلع دریچه مربعی نشان داده شده است. همان طور که از شکل ۵ مشخص است برای ضخامت‌های کمتر از ۵۰ میکرومتر، حساسیت با شیب زیادی افزایش می‌یابد. البته به علت افزایش تلفات تزویج نور بین تار و موج بر (ناشی از کاهش تطابق اندازه موج بر با تار نوری که معمولاً قطر هسته حدود ۹ میکرومتر دارند) در روش ساخت موج بر در  $\text{LiNbO}_3$  (با روش نفوذ فلز Ti تا عمق  $10 \mu\text{m}$ ) امکان کاهش ضخامت کمتر از  $10 \mu\text{m}$ ، به علت تلفات نور ممکن نیست. همین طور از شکل ۶ مشخص است که افزایش طول از ۲ mm تا ۵ mm بدون این که باعث افزایش زیادی در پیچیدگی‌های فرایند ساخت شود، حساسیت تا حدود ۴ برابر می‌شود. بنابراین انتخاب طول ۵ mm و ضخامت  $10 \mu\text{m}$  و حساسیت می‌تواند گزینه مناسبی برای ساخت نسبتاً ساده و حساسیت بالا باشد، که در این صورت مقدار حساسیت فشار و شتاب به ترتیب حدود  $2.33 \times 10^{-4} \frac{\text{rad}}{\text{pas}}$  و  $2.16 \times 10^{-5} \frac{\text{rad/s}^2}{\text{m}}$



شکل ۵ تغییر حساسیت حسگر با تغییرات ضخامت دریچه.

همان طور که از رابطه فوق مشخص است مقدار چرخش متناسب با مقدار مؤلفه غیرقطري است. همین طور هر چه اختلاف اولية قطرهای بیضی (مخرج کسر) کمتر باشد، یا به عبارتی بیضی به شکل دایره نزدیک‌تر باشد، مقدار چرخش بیشتر خواهد بود. همین طور در رابطه فرق از این ویژگی که مقدار کرنش و در نتیجه مقادیر مؤلفه‌های  $da$ ، رابطه خطی با فشار دارند استفاده شده است. به این ترتیب می‌توان مشاهده کرد که حتی برای فشار ۱ MPas، مقدار چرخش بیضی کمتر از یک میکرومتر دیان است که قابل صرف‌نظر می‌باشد. بنابراین با صرف نظر کردن از چرخش بیضی، جهت قطبش دو ویژه‌مد تغییر نمی‌کند. با توجه به این که قطبش اولیه در راستای یکی از ویژه‌مدّها (محور z) در نظر گرفته شده است، تغییر ضربی شکست مشاهده شده توسط نور درون موج بر برابر با تغییر ضربی شکست ویژه‌مد قطبش می‌باشد، و به صورت زیر خواهد بود:

$$\Delta n = \frac{1}{\sqrt{a_{20} + da_2}} - \frac{1}{\sqrt{a_{20}}} \approx -0.5 n_b^3 da_2 \quad (12)$$

در رابطه فوق از تقریب  $da_2 \gg a_{20}$  استفاده شده است. با توجه به این که  $da_2$  در طول موج بر متغیر است، تغییر فاز نور به صورت زیر به دست می‌آید:

$$\Delta\phi = \frac{\pi\pi}{\lambda} \int_{y=0}^{y=1} \Delta n(y) dy = \frac{\pi n_b^3}{\lambda} L \langle da_2 \rangle, \quad (13)$$

که در آن  $\langle da_2 \rangle$  میانگین  $da_2$  در طول موج بر در روی دریچه ( $= 3 \text{ mm}$ ) می‌باشد و  $\lambda = 155 \mu\text{m}$  در نظر گرفته می‌شود به این ترتیب با در نظر گرفتن  $da_2$  در شکل ۵ اختلاف فاز برای فشار یک پاسکال که معادل حساسیت فاز حسگر است، به

یکی از دو شاخه انجام می‌شود، که برای دست‌یابی به آن نیاز به تجهیزات لیتوگرافی با دقیقیت زیاد (حدود  $100\text{ nm}$ ) می‌باشد. اما در صورت استفاده از بلور  $\text{LiNbO}_3$  با توجه به خاصیت الکتروپاتیک مناسب آن، می‌توان از اعمال میدان الکتریکی بر روی یکی از شاخه‌های ماخ-زندر برای ایجاد اختلاف فاز اولیه دلخواه استفاده کرد. در این روش اعمال میدان الکتریکی باعث تغییر ضریب شکست در اثر خاصیت الکتروپاتیک می‌شود. بنابراین این روش که با استفاده از قراردادن الکترودهایی در مجاورت موج بر میسر می‌شود و روشی متبادل برای ساخت مدولاتورهای الکتروپاتیک مجتمع است، می‌تواند باعث کاهش هزینه تولید و هزینه تجهیزات مورد نیاز برای ساخت حسگر شود.

علاوه بر این موارد، مشکل دیگر این نوع حسگرهای وابستگی حساسیت به مقدار تغییر فاز ناشی از فشار رابطه (۲) است. بنابراین حتی در صورت تنظیم فاز اولیه برای دست‌یابی به بیشترین حساسیت، با افزایش فشار حساسیت کاهش می‌یابد. از این جهت نیز استفاده از بلور  $\text{LiNbO}_3$  این مشکل را با امکان تغییر فاز اولیه با تغییر ولتاژ اعمالی به راحتی رفع می‌کند. به این ترتیب با استفاده از یک مدار الکترونیکی حلقه بسته می‌توان همواره نقطه کار حسگر را در بیشترین حساسیت تنظیم کرد. در این صورت اختلاف فاز ایجاد شده در اثر اعمال ولتاژ الکتریکی دقیقاً عکس اختلاف فاز ایجاد شده توسط اعمال فشار است. بنابراین مقدار فشار مستقیماً از مقدار ولتاژ اعمالی برای ثابت نگه داشتن شدت خروجی ماخ-زندر در نقطه کار با بیشترین حساسیت مشخص خواهد شد.

در خصوص تفاوت نوع مدار الکترونیکی مورد نیاز برای طرح ارائه شده در این تحقیق نسبت به مدارات الکترونیکی حسگرهای مبتنی بر MEMS این توضیح لازم است که در مدار الکترونیک حسگرهای مبتنی بر MEMS مدار الکترونیک علاوه بر تأمین ولتاژ کار حسگر، وظیفه خواندن و اندازه‌گیری سیگنال را نیز به عهده دارد و عملده پیچیدگی این نوع مدارات نیز مربوط به بخش خواندن آن است، زیرا برای کاهش نوفه لازم است به صورت مجتمع در کنار حسگر و به صورت همزمان با

خواهد بود. برای مقایسه مقدار حساسیت به دست آمده نسبت به نتایج روش‌های دیگر، می‌توان به موارد مبتنی بر موج‌برهای نوری در دریچه سیلیکونی در مراجع ۸ و ۹ اشاره کرد، که در آنها حساسیت به ترتیب  $\frac{\text{rad}}{\text{pas}} \times 10^{-6}$  و  $\frac{\text{rad}}{\text{pas}} \times 10^{-5}$  به دست آمده است که کمتر از حساسیت به دست آمده در این طراحی است. همین طور در خصوص حساسهای مبتنی بر موج‌برهای نوری در ماده  $\text{LiNbO}_3$  تنها مورد گزارش شده، مربوط به شتاب‌سنج طراحی شده در مرجع [۱۹] در سال ۲۰۱۲ است، که در آن با استفاده از روش جرم آزمون حساسیت شتاب  $\frac{\text{rad/m/s}^2}{\text{s}} \times 10^{-7}$  به دست آمده است. در روش جرم آزمون، کرنش درون موج‌بر به علت فشار ناشی از وزن جرم آزمون اعمال می‌شود، مزیت این روش پیچیدگی کمتر فرایند ساخت ناشی از عدم نیاز به ساخت دریچه است. با این حال همان طور که در این مقاله نشان داده شد، استفاده از دریچه امکان افزایش حساسیت شتاب تا حدود ۲ مرتبه را فراهم می‌کند.

علاوه بر این، باید توجه داشت که حداقل مقدار فشار و شتاب قابل اندازه‌گیری، علاوه بر حساسیت حسگر به مقدار نوفه دستگاه اندازه‌گیری و همچنین نوسانات شدت نور و رودی وابسته خواهد بود. همان طور که قبلاً اشاره شد، مزیت عمده استفاده از ماده  $\text{LiNbO}_3$  علاوه بر افزایش حساسیت، امکان استفاده از خاصیت الکتروپاتیک آن برای ایجاد اختلاف فاز اولیه و مدوله کردن شدت نور با استفاده از اعمال میدان الکتریکی است. این نکته از این جهت حائز اهمیت است که برای اندازه‌گیری اختلاف فاز و تبدیل آن به اختلاف شدت نور قابل اندازه‌گیری توسط آشکارساز، لازم است از یک تداخل سنج اندازه‌گیری توسط آشکارساز، لازم است از یک تداخل سنج ماخ-زندر استفاده شود. این روش باعث می‌شود تا مطابق رابطه (۶) حساسیت حسگر، برای شرایطی که اختلاف فاز اولیه‌ای در دو شاخه ماخ-زندر نباشد، صفر شود. بنابراین لازم است برای دست‌یابی به بیشترین حساسیت اختلاف فاز اولیه دو شاخه موج‌بر برابر با  $\frac{\pi}{2}$  باشد که این امر معمولاً با تغییر طول

دریچه با توجه به محدودیت‌های ساخت انتخاب شد. حساسیت به دست آمده بیشتر از حساسیت حسگرهای مشابه مبتنی بر موج برهای نوری مجتمع است و با توجه به سادگی ساخت موج بر در ماده‌ی انتخابی، همین طور امکان استفاده توأم خواص الکتروپاتیک و الاستروپاتیک برای مدولاسیون و کنترل فاز (برای کاهش نویه و تنظیم نقطه کار سنسور در بیشترین حساسیت) می‌تواند مزیت خوبی برای ساخت حسگرهای فشار و شتاب باشد.

استفاده از فناوری میکروالکترونیک ساخته شود. در حالی که در روش پیشنهادی در این طرح مدار الکترونیک فقط برای اعمال ولتاژ و تعیین نقطه کار حسگر مورد نیاز است و نیازی به مجتمع سازی آن در کنار حسگر نیست.

## ۶. نتیجه‌گیری

در این تحقیق، حسگر فشار و شتاب مبتنی بر یک تداخل سنج ماخ-زندر بر روی دریچه قابل انعطاف LiNbO<sub>3</sub> طراحی شد و اثر ضخامت و طول دریچه بر حساسیت بررسی و ابعاد مناسب

## مراجع

10. J Noda, *Opt. Comm.* **1** (1980) 64.
11. M Valli, A Floretti, and M N Armenise, *J. Modern Optics* **35** (1988) 885.
12. B E A Saleh and M C Teich, "Fundamentals of Photonics", John Wiley (2006).
13. M Jazbinšek and M Zgonik, *Appl. Phys. B* **74** (2002) 407.
14. K Iizuka, "Elements of Photonics", Wiley (2002).
15. ح و مابی، «طراحی مکانیزم‌های صنعتی با استفاده از روش المان محدود در نرم‌افزار ANSYS»، اندیشه‌سرا (۱۳۹۱).
16. R Riveria, G Garcia, J Olivares, M L Crespillo, *Journal of Physics Applied Physics D* **44** (2011) 11.
17. M Domenjoud, M Lematre, M Gratton, M Lethiecq, and L P Tran-Huu-Hue, *IEEE Trans. Ultr. Ferr. Contr.* **60** (2013) 2219.
18. K K Wong, "Properties of Lithium Niobate", INSPEC/Institution of Electrical Engineers (2002).
19. T Dong-Lin, D Bing, H Shan, X Kun-Qing, Z LIANG, and W PENG, *Optica Applicata* **42** (2012) 121.
1. K Zandi *et al.*, *J. MEMS Sys.* **21** (2012) 1464.
2. N Maluf, K Williams, "An Introduction to Microelectromechanical Systems Engineering", Artech House Inc, Boston London (2004).
3. N Di, "Photoelastic and Electro-Optic Effects: Study of PMN-29%PT Single Crystals", Rochester, New York (2009).
4. C P Fernandes, P O J Glantz, S A Svensson, A Bergmark, *Dental Materials* **19** (2003) 106.
5. W B Spillman, *Opt. Lett.* **7** (1982) 388.
6. A Wang, S He, X Fang, X Jin, and J Lin, *J. Lightwave Tech.* **10** (1992) 1466.
7. H Porte, V Gorel, S Kiryenko, J P Goedgebuer, W Daniau, and P Blind, *J. Lightwave Technol.* **17** (1999) 229.
8. R Ambrosio, G Lara, A Jimenez, J Mireles, J Ibarra, and A Heredia, "IEEE, International conference on Simulation oF Semiconductor Processes and Devices", (2012) 324.
9. P K Pattnaik, A Selvarajan, T Badrinarayana and T Srinivas, "Guided Wave Optical MEMS Pressure Sensors", Proc. of ISA/IEEE Conference on Sensors for Industry (2005) 122.